

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11)

Veröffentlichungsnummer:

0 011 738
A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21)

Anmeldenummer: 79104341.7

(51)

Int. Cl.³: C 04 B 41/06

(22)

Anmeldetag: 06.11.79

(30)

Priorität: 04.12.78 US 966188

(43)

Veröffentlichungstag der Anmeldung:
11.06.80 Patentblatt 80:12

(84)

Benannte Vertragsstaaten:
DE FR GB

(71)

Anmelder: International Business Machines
Corporation

Armonk, N.Y. 10504(US)

(72)

Erfinder: Bakos, Peter
530A Reuben Drive
Endicott New York 13760(US)

(74)

Vertreter: Kreidler, Eva-Maria, Dr. rer. nat.
Schönaicher Strasse 220
D-7030 Böblingen(DE)

(54)

Verfahren zur Herabsetzung der Porosität und der Oberflächenrauigkeit einer keramischen Unterlage und Beschichtungsmasse dafür.

(57)

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herabsetzung der Porosität und der Oberflächenrauigkeit einer keramischen Unterlage. Nach diesem Verfahren werden die keramischen Unterlagen mit einer Beschichtungszusammensetzung mit einem Gehalt an einer nicht-polymeren organischen Siliciumverbindung, einer nichtpolymeren äthylenisch ungesättigten Siliciumverbindung, einem Stabilisator und einem Lösungsmittel beschichtet, getrocknet und anschließend zur Umwandlung der Siliciumverbindungen in Siliciumoxide auf höhere Temperaturen erhitzt.

EP 0 011 738 A1

Verfahren zur Herabsetzung der Porosität und der Oberflächen-
rauhigkeit einer keramischen Unterlage

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herabsetzung der Porosität und der Oberflächenrauhigkeit einer keramischen Unterlage und eine Beschichtungszusammensetzung zur Durchführung des Verfahrens sowie die Verwendung dieser Beschichtungszusammensetzung zur Beschichtung von Unterlagen für metallische Schaltkreise.

Keramikunterlagen werden in großem Umfang zur Herstellung integrierter Schaltkreismoduln verwendet. Es ist bekannt, daß die Ergebnisse, die beim Ätzen eines metallischen Überzugs auf einer keramischen Unterlage erhalten werden, in hohem Maße von der Rauigkeit dieser Unterlage beeinflusst werden. Wegen der sich ändernden Eigenschaften einer rauhen keramischen Oberfläche im Hinblick auf Korngröße, Porosität, Kristallinität und Glasphase werden beim Ätzen oft schlechte Ergebnisse erhalten. Diese Probleme treten besonders dann auf, wenn feine Linien oder Schaltkreise hoher Auflösung geätzt werden sollen. Obgleich keramische Unterlagen mit hoher Oberflächenglätte im Handel erhältlich sind, sind diese relativ teuer.

Eine Lösung der Herstellung eines billigen Moduls als Träger für Schaltkreise hoher Auflösung ist, die Keramikunterlage mit einem Überzug aus Polyimid zu beschichten. Die Verwendung von Polyimid zu diesem Zweck wird im IBM Technical Disclosure Bulletin, Volume 20, Nr. 8, Januar 1978, Seite 3020 beschrieben. Die Verwendung von Polyimidüberzügen für diesen Zweck ist jedoch nicht völlig zufriedenstellend, weil das Polyimid, wenn die Moduln hohen Temperaturen ausgesetzt werden, abgebaut wird und in bestimmten Fällen müssen die Moduln während nachfolgender Prozeßschritte hohen Temperaturen (etwa 300 bis 700 °C) ausgesetzt werden. Wenn beispielsweise

Cermet-Widerstandselemente auf dem Modul angebracht werden sollen, muß dieser während des Aufbringens auf hohe Temperaturen erhitzt werden.

- 5 Um alle zuvor angegebenen Forderungen zu erfüllen, müssen die verwendeten Zusammensetzungen eine Reihe wichtiger Eigenschaften aufweisen. Beispielsweise müssen die Zusammensetzungen die Oberflächenglätte einer Keramikunterlage verbessern und gleichzeitig widerstandsfähig gegen hohe
10 Temperaturen, die in nachfolgenden Prozeßschritten angewendet werden, sein. Die Zusammensetzungen müssen darüber hinaus billig sein, damit sie die Kosten für Keramikmaterialien mit glatten Oberflächen, die im Handel erhältlich sind, nicht überschreiten. Weiterhin müssen die angewendeten Materialien elektrisch isolierend sein, damit sie, wenn sie mit
15 der Unterlage verbunden sind, die nachfolgend aufgebrachten Schaltkreise nicht nachteilig beeinflussen, und sie müssen eine glatte Oberfläche erzeugen. Das Material muß auch auf der Keramikunterlage fest haften und eine ausreichende Haftung bezüglich der nachfolgend aufgebrachten Überzüge, be-
20 spielsweise metallischer Überzüge besitzen. Es ist auch erforderlich, daß die Zusammensetzungen eine ausreichende Fließcharakteristik aufweisen, damit sie in die verschiedenen Poren und Spalten der Unterlage eindringen, um die Porosität und Oberflächenrauigkeit der Unterlage zu verbessern. Die
25 angewendete Überzugszusammensetzung muß auch während der nachfolgenden Behandlung der keramischen Unterlagen in den Poren und Spalten verbleiben. Es ist sehr schwierig, eine Zusammensetzung bereitzustellen, die alle die zuvor genannten Eigenschaften in ausreichendem Maße aufweist.
30

Aufgabe der Erfindung ist deshalb ein Verfahren zur Herabsetzung der Porosität und Oberflächenrauigkeit einer keramischen Unterlage, bei dem die zuvor angegebenen Nachteile keramischer Unterlagen nicht auftreten. Aufgabe der
35

Erfindung ist auch die Bereitstellung einer Beschichtungslösung zur Anwendung in diesem Verfahren.

Die Aufgabe der Erfindung wird durch ein Verfahren gemäß
5 Patentanspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen niedergelegt.

Die durch die Erfindung erreichten Vorteile sind darin zu sehen, daß keramische Unterlagen mit niedriger Porosität
10 und Oberflächenrauhigkeit hergestellt werden können. Die in dem erfindungsgemäßen Verfahren verwendeten Materialien sind sehr billig und führen zu Überzügen, die sowohl auf der Unterlage haften wie auch eine gute Adhäsion zu den nachfolgend aufgetragenen Metallüberzügen aufweisen. Be-
15 sonders hervorzuheben ist, daß die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren aufgetragenen Überzüge besonders widerstandsfähig gegen nachfolgend angewendete hohe Temperaturen sind.

20 Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Herabsetzung der Porosität und der Oberflächenrauhigkeit einer keramischen Unterlage. Das Verfahren umfaßt das Auftragen einer flüssigen Beschichtungsmasse, welche wenigstens eine nichtpolymere Siliciumverbindung enthält, auf wenig-
25 stens eine Oberfläche der keramischen Unterlage. Die Unterlage wird dann getrocknet und einer erhöhten Temperatur ausgesetzt oder unterworfen, welche höher als die bei der Trocknung angewendete Temperatur ist. Dadurch wird die Siliciumverbindung, welche auf dem Substrat zurückbleibt,
30 in Siliciumoxide überführt und eine keramische Unterlage einer niedrigen Porosität und Oberflächenrauhigkeit erhalten.

Die vorliegende Erfindung betrifft auch Mischungen bevorzugter Organosiliciumverbindungen, welche etwa 45 bis 95 Gew.% bestimmter gesättigter Organosilane und etwa 5 bis 55 Gew.% bestimmter äthylenisch ungesättigter Organosilan-
5 verbindungen enthalten. Die Gew.% beziehen sich auf den Gesamtgehalt der Zusammensetzung an gesättigten und ungesättigten Organosilanverbindungen.

Die Unterlagen, die gemäß der Erfindung behandelt werden
10 sollen, sind vorzugsweise keramische Unterlagen. Diese enthalten Siliciumoxide und Silicate wie Aluminiumsilicate und Aluminiumoxide. Die keramischen Unterlagen, welche durch das erfindungsgemäße Verfahren am meisten verbessert werden, sind solche, welche eine Oberflächenrauigkeit von
15 wenigstens etwa 10 μm aufweisen. Es können natürlich auch Unterlagen mit einer niedrigeren Oberflächenrauigkeit erfindungsgemäß behandelt werden. Die Oberflächenrauigkeit wird ausgedrückt durch den Mittelwert der Mittellinie zwischen der Höhe einer Spitze und der Tiefe einer Ver-
20 tiefung auf der Oberfläche der Unterlage. Die vorliegende Erfindung findet besonders Anwendung bei der Herstellung von Unterlagen für integrierte Schaltkreismoduln und insbesondere bei der Herstellung von Schaltkreisen mit hoher Auflösung.

25

Ein Überzug, welcher wenigstens eine Siliciumverbindung enthält, wird mindestens auf eine Oberfläche der keramischen Unterlage aufgetragen. Die verwendeten Siliciumverbindungen sind nichtpolymere Verbindungen. Die Verwendung polymerer
30 Organosiliciumverbindungen ist für die Zwecke der vorliegenden Erfindung, d. h. für die Herstellung glatter Oberflächen nicht geeignet, weil diese Verbindungen bei dem Erhitzen, das in dem erfindungsgemäßen Verfahren durchgeführt wird,

- in zu hohem Maße zur Karbonisierung auf der Oberfläche der Unterlage neigen. Die Verwendung von Polysiliciumverbindungen zur Imprägnierung von Ziegelsteinen, um diese weniger porös zu machen und ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber geschmolzenem Glas zu verbessern, ist in der US-Patentschrift 3 816 163 beschrieben. Dort ist angegeben, daß die Polysiliciumverbindungen nach der Imprägnierung der Ziegelsteine einer thermischen Zersetzung zu Siliciumdioxid unterworfen werden. Die genannten Verbindungen sind jedoch, weil sie polymerer Natur sind, für einen der wesentlichen Zwecke der vorliegenden Erfindung, der Verbesserung der Oberflächenrauhigkeit, nicht geeignet wegen ihrer Tendenz zur Karbonisierung.
- Andere Beispiele für die Anwendung polymerer oder harzartiger Siliciumverbindungen sind in den US-Patentschriften 4 041 190 und 3 617 341 beschrieben. In der US-Patentschrift 4 041 190 ist die Bildung eines Siliciumdioxidüberzugs beschrieben, wobei ein Polysiloxan einer Bestrahlung und anschließend einer thermischen Behandlung ausgesetzt wird. In der US-Patentschrift 3 617 341 ist die Ausbildung eines Überzugs durch die Zersetzung einer Formulierung, welche ein Siliciumresinat enthalten kann, beschrieben.
- Weiterhin ist es wesentlich, daß die Überzugszusammensetzung, die auf die keramische Unterlage aufgetragen wird, flüssig und fließfähig ist, damit gewährleistet ist, daß die Siliciumverbindungen einwandfrei in die Poren, die Risse oder Vertiefungen der Unterlage fließen. Die Verwendung von Organosiliciumverbindungen in Dampfform zur Beschichtung verschiedener Unterlagen wurde auch beschrieben, aber diese Art der Anwendung gestattet die vollständige Ausfüllung der Risse oder Unregelmäßigkeiten auf der Unterlage, wie es erfindungsgemäß gefordert wird, nicht. Beispiele für die

Abscheidung von Organosiliciumverbindungen aus der Dampfphase sind in den US-Patentschriften 3 243 314 und 3 242 007 beschrieben. In der US-Patentschrift 3 243 314 ist die Anwendung von Vinyltriäthoxysilan für die thermische Zersetzung zu Siliciumdioxiden, welche eine passivierende Schicht auf einer Halbleitervorrichtung bilden, beschrieben. In der US-Patentschrift 3 242 007 ist die Ausbildung eines Schutzüberzugs auf einer Halbleitervorrichtung aus der Dampfphase beschrieben, wobei das angewendete Siloxan Vinyltriäthoxysilan sein kann.

Ein weiterer Vorteil der Anwendung der Zusammensetzung in flüssiger Form im Gegensatz zur Abscheidung aus der Dampfphase ist, daß die Dicke genau kontrolliert werden kann. Zusätzlich können sehr dünne Überzüge hergestellt werden, welche bereits vorhandene Öffnungen auf der keramischen Unterlage, die anschließend für die Einführung von Stiften verwendet werden, nicht verstopfen.

Ein anderer Stand der Technik, welcher in diesem Zusammenhang von Interesse ist, ist die US-Patentschrift 3 086 892, auf die weiter unter noch eingegangen wird. Weiterer Stand der Technik, welcher in weiterem Sinn von Interesse ist, schließt die US-Patentschriften 2 859 139, 3 547 680, 3 720 542, 3 932 691 und 3 962 004 ein. In diesen Patentschriften wird vorgeschlagen, flüssige Zusammensetzungen mit einem Gehalt an einem Siloxan oder Silicon, welches nachfolgend durch Anwendung von Hitze zersetzt wird, anzuwenden. Weiterhin können die US-Patentschriften 3 055 776, 3 158 495, 3 523 819, 3 668 004 und 4 047 977 im Hinblick auf die Zersetzung von Siliconen bei erhöhten Temperaturen von Interesse sein.

Beispiele geeigneter Siliciumverbindungen zur erfindungsgemäßen Verwendung schließen gesättigte Organosiliciumverbindungen

dungen, äthylenisch ungesättigte Organosiliciumverbindungen und Siliciumhalogenide wie Trichlorsilan und Siliciumtetrachlorid ein.

- 5 In der vorliegenden Erfindung wird die Verwendung flüssiger Organosilane als Siliciumverbindungen bevorzugt. Obgleich, wie zuvor erwähnt, auch Siliciumhalogenide wie Trichlor-
10 silan und Siliciumtetrachlorid verwendet werden können, werden diese nicht besonders bevorzugt wegen des verhältnismäßig hohen Anteils an Chlor, der in diesen Verbindungen vorhanden ist und der bei der Zersetzung zu einer Diffusion unerwünschter Mengen von Chlorgas in die Unterlage führen kann. Dadurch können Korrosions- und Zuverlässigkeitsprobleme bei integrierten Schaltkreisen auftreten, bei denen so
15 behandelte Unterlagen verwendet werden.

- Gemäß der vorliegenden Erfindung wird noch mehr bevorzugt, wenigstens eine äthylenisch ungesättigte Organosilicium-
20 verbindung in der Beschichtungszusammensetzung zu verwenden. Die äthylenisch ungesättigten Verbindungen können mono-äthylenisch ungesättigt sein oder mehr als eine äthylenisch ungesättigte Gruppe enthalten. Die bevorzugten Verbindungen der erfindungsgemäßen Verwendung enthalten wenigstens eine gesättigte Organosiliciumverbindung und wenigstens eine
25 äthylenisch ungesättigte Organosiliciumverbindung. Wenn eine Mischung gesättigter und ungesättigter Organosiliciumverbindungen verwendet wird, enthalten diese Zusammensetzungen vorzugsweise 5 bis 55 Gew.% der äthylenisch ungesättigten Organosiliciumverbindung und etwa 45 bis 95 Gew.% der ge-
30 sättigten Organosiliciumverbindung. Die zuvor angegebenen relativen Prozentgehalte beziehen sich auf den Gesamtgehalt an äthylenisch ungesättigten und gesättigten Organosiliciumverbindungen in den Zusammensetzungen.

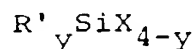
Die Verwendung äthylenisch ungesättigter Verbindungen wird erfindungsgemäß bevorzugt, weil diese Verbindungen bei dem zuerst durchgeführten Trocknen zu einer Gelbildung und bis zu einem gewissen Grad zu einer Vernetzung neigen, wodurch
5 die Zusammensetzung in den Rissen in der Unterlage in einem ausreichenden Maß fest wird, so daß die Unterlagen gehandhabt und/oder nachfolgenden Behandlungen zugeführt werden können. Dieser Aspekt ist besonders wichtig, wenn die zu behandelnde Unterlage im wesentlichen nicht eben ist.

10

In der am meisten bevorzugten Ausführungsform der Erfindung werden Mischungen gesättigter und ungesättigter Organosiliciumverbindungen verwendet. Die Gegenwart einer gesättigten Verbindung in der Zusammensetzung neben einer ungesättigten
15 Organosiliciumverbindung bewirkt, daß die Tendenz der ungesättigten Verbindungen zur Polymerisation, verglichen mit der Verwendung ungesättigter Verbindungen allein, herabgesetzt wird. Demnach werden in Gegenwart von gesättigten Verbindungen Überzüge erhalten, welche nach dem Zersetzungsschritt einen geringeren Rückstand ergeben, als wenn ungesättigte Verbindungen allein verwendet wurden. Durch die
20 Gegenwart gesättigter Verbindungen wird auch erreicht, daß das Endprodukt einen glänzenden Überzug aufweist und im Gegensatz dazu etwas pulverförmiges Material anfällt, wenn
25 nur ungesättigte Organosilane verwendet werden. Darüber hinaus sind in vielen Fällen gesättigte Organosilane weniger toxisch und billiger als äthylenisch ungesättigte Silane.

Im allgemeinen sind gesättigte Organosilane (Verbindungen, die keine nicht-benzoiden ungesättigten Strukturen enthalten)
30 für die Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens geeignet. Sie können dargestellt werden durch die folgende allgemeine Formel:

35

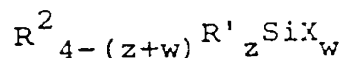


in der R'_y ein organischer Rest oder eine Mischung verschiedener organischer Reste wie Alkyl, Aryl, Alkaryl, Cycloalkyl, Aralkyl, Acyl, Alkoxy und Aryloxy ist. Diese Reste können unsubstituiert oder durch einen oder mehrere Substituenten wie Amino, Hydroxy, Epoxid oder Halogen substituiert sein. Beispiele einiger geeigneter Alkylgruppen sind diejenigen, welche bis zu etwa acht Kohlenstoffatome enthalten, wobei Methyl, Äthyl, Propyl, Hexyl und Octyl als Beispiele genannt sind. Beispiele einiger Cycloalkyl-Gruppen sind Reste mit bis zu sechs Kohlenstoffatomen, beispielsweise Cyclohexyl, Cyclobutyl und Cyclopentyl. Beispiele einiger Aryl-Reste schließen Alkaryl und Aralkyl-Reste ein, in denen der Aryl-Rest bis zu zehn Kohlenstoffatome enthält. Als solche seien Phenyl, Methylphenyl, Benzyl und Phenyläthyl genannt. Die Alkoxy-Reste enthalten im allgemeinen bis zu acht Kohlenstoffatome, und als Beispiele werden Methoxy, Äthoxy und Propoxy genannt. Als Beispiel für ein Aryloxy-Rest wird Benzoxoxy genannt. Wenn R' ein Acyl-Rest ist, der im allgemeinen bis zu etwa acht Kohlenstoffatome enthält, kann er Acetyl, Propionyl und Butyryl sein. Beispiele einiger aminosubstituierter Kohlenwasserstoff-Reste schließen Aminopropyl und Aminoäthyl ein. Beispiele einiger hydroxysubstituierter Kohlenwasserstoff-Reste schließen Hydroxyäthyl und Hydroxypropyl ein. Beispiele epoxidsubstituierter Kohlenwasserstoff-Reste schließen 3,4-Epoxidcyclohexyl und Glycidoxypropyl ein. Beispiele einiger halogensubstituierter Reste schließen Pentachlorphenyl, 1-Brom-3-trichlorpropyl und Perfluoralkyl-Reste wie γ -Trifluorpropyl und δ -Trifluor- γ -difluorbutyl ein. Wenn es gewünscht wird, können auch Mischungen organischer Reste verwendet werden. Y ist eine ganze Zahl von 1 bis 4. X bedeutet Wasserstoff oder Halogen, beispielsweise Chlor.

Beispiele einiger geeigneter gesättigter Organosilanverbindungen schließen Äthyltriäthoxysilan, Amyltriäthoxysilan,

Äthyltrichlorsilan, Amyltrichlorsilan, Phenyltrichlorsilan, Phenyltriäthoxysilan, Methyltrichlorsilan, Methyldichlorsilan, Dimethyldichlorsilan, Methyltriäthoxysilan, Dimethyldiäthoxysilan, β -(3,4-Epöxidcyclohexyl)-äthyltrimethoxysilan, γ -Aminopropyltriäthoxysilan, N-bis(β -hydroxyäthyl)- γ -aminopropyltriäthoxysilan, N- β (Aminoäthyl)- γ -aminopropyltrimethoxysilan und γ -Glycidoxypropyltrimethoxysilan ein.

Die äthylenisch ungesättigten Organosilanverbindungen, die zur Durchführung der vorliegenden Erfindung geeignet sind, können durch die folgende Formel dargestellt werden:



in der z und w jeweils ganze Zahlen von 0 bis 3 darstellen, vorausgesetzt, daß die Summe von $z+w = 3$ oder weniger ist. R' und X haben die zuvor angegebene Bedeutung. R^2 ist ein äthylenisch ungesättigter organischer Rest und kann monoäthylenisch oder polyäthylenisch ungesättigt sein. Beispiele einiger äthylenisch ungesättigter Reste schließen Vinyl, Allyl, 3-Butenyl, Acryl, Methacryl, Oleyl und Linolein ein. Beispiele einiger äthylenisch ungesättigter Organosiliciumverbindungen schließen Vinyltrichlorsilan, Vinyltriäthoxysilan, Vinyltriacetoxysilan, γ -Methacryloxypropyltrimethoxysilan, Methylvinyl-dichlorsilan und Vinyl-tris(2-methoxyäthoxy)-silan ein.

Mischungen gesättigter Organosiliciumverbindungen und/oder Mischungen äthylenisch ungesättigter Organosiliciumverbindungen können, wenn es gewünscht wird, auch verwendet werden.

Die Siliciumverbindungen werden im allgemeinen in Verbindung mit einem Verdünnungsmittel angewendet, um die gewünschte Viskosität zu erhalten, die von der Anwendung der Zusammensetzung abhängt. Im allgemeinen enthalten die Zu-

sammensetzungen etwa 25 bis etwa 90 Gew.% Verdünnungsmittel. Das Verdünnungsmittel sollte ein bei niedriger Temperatur verdampfendes Material sein, welches als Lösungsmittel für die Siliciumverbindung wirkt, aber im wesentlichen nicht mit der Siliciumverbindung und/oder mit der Keramikunterlage reagiert. Beispiele geeigneter organischer Verdünnungsmittel schließen Alkohole wie Methanol, Äthanol, und Propanol; Ketone wie Aceton und Methyläthylketon und aromatische Verdünnungsmittel wie Benzol, Toluol und Xylol ein. Die Zusammensetzung kann durch Aufsprühen, durch Ver-
5 10 15 20 25 30 35

tragen werden.
Die Zusammensetzungen können auch andere Bestandteile wie Stabilisatoren enthalten, welche die Lagerbeständigkeit der Zusammensetzungen verbessern. Ein bestimmter Stabilisator ist Piperidin. Er wird im allgemeinen in einer Menge von etwa 2,5 bis 7 Gew.% verwendet.

Üblicherweise wird der Überzug in einem einstufigen Beschichtungsverfahren in einer Naßschichtdicke bis zu etwa 0,1 mm aufgetragen. Dies wird durchgeführt, um die Verkohlungs des Materials während des nachfolgenden Erhitzens zu verhindern. Wenn es erforderlich ist, dickere Filme herzustellen, dann können Mehrfachbeschichtungsverfahren (zwei oder mehr Beschichtungsschritte) angewendet werden, nachdem die zuvor aufgetragene Beschichtung getrocknet und den entsprechenden Zersetzungsschritten unterworfen wurde.

Nachdem die Zusammensetzung aufgetragen ist, wird sie einem ersten Erhitzen unterworfen. Die beschichtete Unterlage wird auf eine Temperatur unterhalb des Siedepunkts der Siliciumverbindung erhitzt, im allgemeinen auf eine Temperatur zwischen etwa 50 und 200 °C. Dieses Erhitzen wird so lange fortgeführt, bis alles organische inerte Verdünnungsmittel

entfernt ist, was im allgemeinen etwa 30 Min. bis etwa 2 Std. in Anspruch nimmt.

Das beschichtete Substrat wird dann höheren Temperaturen
5 ausgesetzt als beim ersten Erhitzen, um die Siliciumverbindungen in Siliciumoxide zu überführen. Die genaue Zusammensetzung des Siliciumoxid-Rückstands konnte nicht bestimmt werden; aber es ist wahrscheinlich, daß nicht eine einzige Substanz wie Siliciumdioxid, sondern eine Mischung aus Silicium-
10 oxiden, welche Siliciumdioxid und Siliciummonoxid enthält, vorliegt. Im allgemeinen wird die Unterlage erhöhten Temperaturen von etwa 500 bis 1700 °C, vorzugsweise von etwa 700 bis 1300 °C unterworfen. Die Zeit für diese Hitzebehandlung liegt zwischen etwa 2 und etwa 6 Stunden. Die Hitze-
15 behandlungen können unter normalen atmosphärischen Bedingungen in Gegenwart von Luft oder in inerter Atmosphäre durchgeführt werden.

Die Zeiten und die Temperaturen der zuvor angegebenen Er-
20 hitzungsstufen sind zueinander invers. Wenn beispielsweise die Temperatur zunimmt, nimmt die Zeit bis zum Erhalt der gewünschten Ergebnisse ab.

Die Anwendung von wenigstens zwei Erhitzungsstufen ist wesentlich für die erfolgreiche Durchführung der Erfindung. Die
25 Möglichkeit der Verunreinigung der Substratoberfläche zu einem nicht mehr annehmbaren Grad mit unerwünschtem Rückstand anders als Siliciumoxid wird im wesentlichen dadurch reduziert, daß zuerst das Verdünnungsmittel entfernt wird
30 und dann die Siliciumverbindungen zersetzt werden. Bei Anwendung nur einer einmaligen Erhitzung findet eine Verkohlung in nicht mehr vertretbarem Maße statt. Durch das mehrstufige Erhitzen wird bei der Zersetzung eher eine glänzende als eine pulverförmige Phase erhalten. Wenn darüber hinaus in
35 den bevorzugten Ausführungsbeispielen eine ungesättigte

Organosiliciumverbindung verwendet wird, findet beim ersten Erhitzen bis zu einem gewissen Grad eine Gel-Bildung der ungesättigten Organosiliciumverbindung statt, welche ihrerseits dazu führt, daß die Siliciumverbindungen in
5 ausreichendem Maße unbeweglich werden und so in den Poren, und Spalten der Keramik haften bleiben.

Keramikunterlagen, die nach dem zuvor angegebenen Verfahren erhalten werden, weisen eine niedrige Porosität und eine
10 herabgesetzte Oberflächenrauigkeit zusammen mit einer glasartigen Oberfläche auf, die durch die Zersetzung der Siliciumverbindung erhalten wurde. Die Überzugszusammensetzung verbessert die Oberflächenrauigkeit, indem Löcher und Fehlstellen in der Oberfläche ausgefüllt werden. Es wurde vor-
15 geschlagen, entweder Halbleiterwafer oder ein Elektrodenkügelchen mit einer Lösung bestimmter Organosiliciumverbindungen zu beschichten, um bei der Herstellung von Halbleiterbauelementen vom Sperrschichttyp einen Rückstand von Siliciumoxiden, die an dem Kügelchen oder an der Waferoberfläche
20 haften, zu bilden. Eine Vorrichtung dieser Art ist beispielsweise in der US-Patentschrift 3 086 892 beschrieben. Das Verfahren zur Herstellung des Halbleiterbauelements vom Sperrschichttyp, das in dieser Patentschrift beschrieben ist, führt nicht zu einer Verbesserung der Oberflächenunregelmäßig-
25 keiten der in diesem Verfahren verwendeten Unterlagen. Das Verfahren, das in dieser Patentschrift beschrieben ist, umfaßt das Einlegieren des Kügelchens in den Wafer während der Zersetzung der Organosiliciumverbindung zu Siliciumoxiden. Die vorhandenen Siliciumoxide verhindern ein zu starkes
30 Ausbreiten des Kügelchens auf der Waferoberfläche während des Legierens. Als Endprodukt wird jedoch als Folge der Bedingungen während des Legierens eine wabenartige Struktur und keine im Hinblick auf die Oberflächenglätte verbesserte Oberfläche, wie erfindungsgemäß gefordert, erhalten.

- Das erfindungsgemäße Verfahren findet, wie zuvor beschrieben, insbesondere Anwendung zur Herstellung von Keramikmodulen für integrierte Schaltkreise und dient im besonderen zum Grundieren oder Vorbereiten der Keramikoberflächen für die
5. nachfolgende Metallabscheidung. Deshalb wird das Verfahren gemäß der Erfindung besonders dann angewendet, wenn die Keramikunterlage zur Herstellung von Schaltkreisen hoher Auflösung verwendet und anschließend mit Metall oder mit Metallen beschichtet wird. In einer Ausführungsform wird beispielsweise eine Chrom-Kupfer-Chrom-Metallisierung aufgetragen. Das
- 10 Metallisierungsmuster kann unter Anwendung konventioneller Verfahren hergestellt werden, und es werden Schaltkreise mit hoher Auflösung erhalten.
- 15 Die vorliegende Erfindung ist besonders zur Herstellung von Keramikunterlagen für integrierte Schaltkreise geeignet, weil die Produkte, die auf der Unterlage zurückbleiben (Siliciumoxide) elektrisch isolierende Eigenschaften aufweisen und gute thermische Leiter sind. Die Eigenschaften der
- 20 guten Ableitung von Hitze sind nicht vorhanden, wenn beispielsweise Polyimide verwendet werden.

Beispiel 1

- Eine Zusammensetzung, die etwa 1,8 g β -(3,4-Epoxidcyclohexyl)äthyl-trimethoxysilan, 0,6 g Vinyltrichlorsilan, etwa
- 25 1,1 g Aminopropyltrimethoxysilan, etwa 1,0 g Piperidin und etwa 20,5 g Toluol enthält, wird in einem Tauchbeschichtungsverfahren auf eine Keramikunterlage zu einer Naßschichtdicke von etwa 30 μm aufgetragen. Die Keramikunterlage hat
- 30 eine Oberflächenrauigkeit oder einen Mittelwert der Mittellinie von etwa 28 bis 34 μm . Die beschichtete Unterlage wird dann in einen Ofen gebracht und etwa 90 Min. lang bei etwa 100 °C getrocknet. Die getrocknete und beschichtete Keramikunterlage wird in einen Ofen gebracht und in Umgebungs-

atmosphäre etwa 4 Stunden lang einer erhöhten Temperatur von etwa 700 bis 1000 °C ausgesetzt. Die Keramikunterlage hat eine Oberflächenrauigkeit von nur 14 bis 18 µm (Mittelwert der Mittellinie) und das resultierende Zersetzungsprodukt der Organosiliciumverbindung ist ein glasartiges Material. Während des Beschichtens wurde beobachtet, daß der Film einheitlich auf der gesamten Substratoberfläche fließt. Das oben angegebene Beschichtungsverfahren wie auch das Trocknen und die Zersetzungsschritte werden erneut angewendet unter Erhalt einer Keramikunterlage nach dieser zweiten Beschichtung mit einer Oberflächenrauigkeit von nur 5 bis 11 µm (Mittelwert der Mittellinie).

Beispiel 2

Beispiel 1 wird wiederholt mit der Ausnahme, daß die Zusammensetzung etwa 1,8 g β -(3,4-Epoxidcyclohexyl)äthyl-trimethoxysilan, etwa 1,0 g Vinyltriäthoxysilan, etwa 0,7 g Vinyltriacetoxysilan, etwa 1,0 g Piperidin und etwa 20,5 g Toluol enthält. Es werden ähnliche Ergebnisse wie in Beispiel 1 erhalten.

Beispiel 3

Beispiel 1 wird wiederholt mit der Ausnahme, daß die Beschichtungszusammensetzung etwa 1,8 g β -(3,4-Epoxidcyclohexyl)äthyl-trimethoxysilan, etwa 1,2 g Vinyl-tris(2-methoxyäthoxy)silan, etwa 0,5 g Vinyl-triacetoxysilan, etwa 1,0 g Piperidin und etwa 20,5 g Toluol enthält. Es werden ähnliche Ergebnisse wie in Beispiel 1 erhalten.

Beispiel 4

Beispiel 1 wird wiederholt mit der Ausnahme, daß die Beschichtungszusammensetzung etwa 1,8 g β -(3,4-Epoxidcyclohexyl)äthyl-trimethoxysilan, etwa 1,7 g Aminopropyltri-

methoxysilan, etwa 1,0 g Piperidin und etwa 20,5 g Toluol enthält. Es werden ähnliche Ergebnisse wie in Beispiel 1 erhalten, jedoch wird die Oberflächenrauhigkeit nicht in dem Maße wie in den Beispielen 1 bis 3 herabgesetzt. In diesem
5 Beispiel wurden keine ungesättigten Silane verwendet und , demzufolge findet ein Vernetzen und eine Gel-Bildung von Silanverbindungen wie in den Beispielen 1 bis 3 nicht statt. Durch das Vernetzen und die Gel-Bildung wird in den Beispielen 1 bis 3 verglichen mit Beispiel 4 eine einheitliche-
10 re und größere Beschichtungsdicke erhalten, wodurch wiederum dickere Siliciumoxidschichten und eine größere Oberflächenverbesserung nach der Hochtemperaturzersetzung erhalten werden.

P A T E N T A N S P R Ü C H E

1. Verfahren zur Herabsetzung der Porosität und der Oberflächenrauigkeit einer keramischen Unterlage,
5 dadurch gekennzeichnet,
daß eine flüssige Beschichtungszusammensetzung mit einem Gehalt an wenigstens einer nichtpolymeren organischen Siliciumverbindung auf wenigstens eine Oberfläche der Unterlage aufgetragen wird, die beschichtete Unterlage getrocknet und zur Umwandlung der Organosiliciumverbindungen in Siliciumoxide einer Temperatur ausgesetzt wird, die höher als die bei der Trocknung angewendete ist.
10
- 15 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Unterlage ein Keramikmaterial aus Siliciumoxid, Silicat und Aluminiumoxid angewendet wird.
- 20 3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß eine Beschichtungszusammensetzung mit einem Gehalt an einer Siliciumverbindung aus der Gruppe der gesättigten organischen; der äthylenisch ungesättigten organischen Siliciumverbindungen; der Siliciumhalogenide und Mischungen derselben angewendet wird.
25
4. Verfahren nach den Ansprüchen 1 und 3, dadurch gekennzeichnet, daß eine Beschichtungszusammensetzung, die wenigstens ein flüssiges Organosilan enthält, angewendet wird.
30
5. Verfahren nach den Ansprüchen 1 und 3, dadurch gekennzeichnet, daß eine Beschichtungszusammensetzung, die wenigstens eine äthylenisch ungesättigte und wenigstens eine gesättigte organische Siliciumverbindung enthält,
35 angewendet wird.

6. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß eine Beschichtungszusammensetzung, die β -(3,4-Epoxid-cyclohexyl)äthyl-trimethoxysilan und eine äthylenisch ungesättigte organische Siliciumverbindung aus der Gruppe von Vinyltrichlorsilan, Vinyltriäthoxysilan, Vinyl-tris(2-methoxyäthoxy)-silan, Vinyltriacetoxysilan und Mischungen derselben enthält, angewendet wird.
7. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß eine Beschichtungszusammensetzung, die zusätzlich Aminopropyltriäthoxysilan enthält, angewendet wird.
8. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß eine Beschichtungszusammensetzung, die zusätzlich ein organisches Lösungsmittel und einen Stabilisator enthält, angewendet wird.
9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß eine Beschichtungszusammensetzung, die das Verdünnungsmittel in einer Menge von etwa 25 bis 90 Gew.%, bezogen auf den Gesamtgehalt an Lösungsmittel und Siliciumverbindungen in der Zusammensetzung enthält, angewendet wird.
10. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß eine Zusammensetzung, die einen Stabilisator in einer Menge von etwa 2,5 bis 7 Gew.%, bezogen auf den Gesamtgehalt an organischer Siliciumverbindung, Verdünnungsmittel und Stabilisator enthält, angewendet wird.

11. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß die Beschichtungszusammensetzung in einem Beschich-
tungsschritt in einer Naßschichtdicke bis zu 0,1 mm
aufgetragen wird.
- 5 12. Verfahren nach den Ansprüchen 1 und 11,
dadurch gekennzeichnet,
daß ein Mehrfachbeschichtungsverfahren angewendet wird.
- 10 13. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß die beschichtete Unterlage 30 Minuten bis 2 Stunden
lang bei einer Temperatur von etwa 50 bis 200 °C ge-
trocknet wird.
- 15 14. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß die getrocknete beschichtete Unterlage etwa 2
bis 6 Stunden lang auf etwa 500 bis 1700 °C, vorzugs-
weise 700 bis 1300 °C erhitzt wird.
- 20 15. Verfahren nach den Ansprüchen 1 und 14,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Erhitzen in Gegenwart von Luft durchgeführt
wird.
- 25 16. Beschichtungszusammensetzung zur Durchführung des Ver-
fahrens nach den Ansprüchen 1 bis 15, gekennzeichnet
durch einen Gehalt an etwa 45 bis 95 Gew.% einer ge-
sättigten organischen Siliciumverbindung aus der Gruppe
von β -(3,4-Epoxidcyclohexyl)äthyltrimethoxysilan und
30 Mischungen derselben mit Aminopropyltrimethoxysilan
und etwa 5 bis 55 Gew.% einer ungesättigten organi-
schen Siliciumverbindung aus der Gruppe von Vinyltri-
chlorsilan, Vinyltriäthoxysilan, Vinyl-tris(2-methoxy-
äthoxy)silan, Vinyltriacetoxysilan und Mischungen der-

selben, wobei die Gew.% bezogen sind auf den Gesamtgehalt an gesättigten und ungesättigten organischen Siliciumverbindungen in der Zusammensetzung.

- 5 17. Verwendung der Beschichtungszusammensetzung nach Anspruch 16 zur Herabsetzung der Porosität und der Oberflächenrauigkeit einer keramischen Unterlage für metallische Schaltkreise.



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0011738
Nummer der Anmeldung

EP 79 104 341.7

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.)
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	betrifft Anspruch	
	DE - A1 - 2 451 850 (SNAM PROGETTI) * Ansprüche 1, 2; Seite 4 *	1,3,4, 8,13, 14,15	C 04 B 41/06
	--		
D	US - A - 3 086 892 (HUNTINGTON) * Ansprüche 1, 7; Spalte 3, Zeilen 1 bis 7 und 36 bis 50 *	1,3,4, 8	
	--		
A	DE - B2 - 2 053 110 (DYNAMIT NOBEL)		RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.)
	--		
A,D	US - A - 3 055 776 (STEVENSON et al.)		C 04 B 41/00 H 01 L 21/00
	--		
A,D	US - A - 3 243 314 (H.S. LEHMAN et al.)		

			KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE
			X: von besonderer Bedeutung A: technologischer Hintergrund O: nichtschriftliche Offenbarung P: Zwischenliteratur T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E: kollidierende Anmeldung D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus andern Gründen angeführtes Dokument S: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument
X Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort Berlin		Abschlußdatum der Recherche 19-02-1980	Prüfer HÖRNER

EPA form 1503.1 06.78

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.

PCT/DE 00/02023

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 H01L21/48 H01L23/498

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched: classification system followed by classification symbols;

IPC 7 H01L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
Y	US 5 906 859 A (LIU YOUFAN ET AL) 25 May 1999 (1999-05-25) claims	1-7, 11-13, 16
Y	EP 0 270 241 A (DOW CORNING) 8 June 1988 (1988-06-08) column 5, line 13 - line 44; examples column 9, line 12 - line 38; claim 1	1-7, 11-13, 16
A	EP 0 011 738 A (IBM) 11 June 1980 (1980-06-11) page 10, line 32 - line 12; figure 11	5



Further documents are listed in the continuation of box C.



Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance: the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance: the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document: member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

20 October 2000

Date of mailing of the international search report

27/10/2000

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5819, Patentstra e 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel: (+31-70) 340-2040, Tx: 31 65* epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Prohaska, G

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

International Application No.

PCT/DE 00/02023

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 5906859 A	25-05-1999	EP 0971400 A JP 2000106363 A	12-01-2000 11-04-2000
EP 0270241 A	08-06-1988	US 4749631 A CA 1329738 A DE 3787446 D DE 3787446 T ES 2005955 A JP 6042478 B JP 63155624 A KR 9511560 B	07-06-1988 24-05-1994 21-10-1993 21-04-1994 01-04-1989 01-06-1994 28-06-1988 06-10-1995
EP 0011738 A	11-06-1980	US 4230773 A CA 1108355 A DE 2963901 D IT 1165392 B JP 1181951 C JP 55075981 A JP 58009791 B	28-10-1980 08-09-1981 25-11-1982 22-04-1987 09-12-1983 07-06-1980 22-02-1983